Crescimento de grãos em cerâmica Y-TZP nanoestruturada sinterizada em baixas temperaturas

(Grain growth in sintered nanostructured Y-TZP ceramics at low temperatures)

M.P. Cangani¹; M.N. Quintino²; D. Rodrigues Júnior¹; C. Santos²; E. Saito¹; J.P.B. Machado³

¹ Escola de Engenharia de Lorena - USP Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP ² Faculdade de Tecnologia Campus Regional de Resende - UERJ Rodovia Presidente Dutra km 298, Pólo Industrial – Resende-RJ ³ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Av. dos Astronautas, 1.758 - Jardim da Granja, São José dos Campos - SP

Resumo

Neste trabalho, o efeito dos parâmetros de sinterização no crescimento de grãos das cerâmicas nanométricas a base de Y-TZP sinterizadas a 1300°C e 1400°C, foi estudada utilizando processamento digital. Pós de zircônia foram compactados a 80MPa e posteriormente sinterizadas em temperaturas de 1300°C ou 1400°C em diferentes patamares, variando de 2 a 16h, e então, caracterizadas por difração de raios-X e densidade relativa em microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicaram que em todas as condições de sinterização a densidade relativa obtida foi superior a 97% independente da condição de sinterização utilizada. Em todas as amostras ZrO₂ tetragonal foi a principal fase cristalina observada. A caracterização microestrutural indica que os pós apresentam tamanhos médios nanométricos variando entre 40-90 nm e 55-160 nm, em função do tempo de patamar a 1300°C e 1400°C respectivamente. Os resultados são discutidos em função do crescimento de grão observado e dos efeitos dessas características nanoestruturadas em sua respectiva tenacidade a fratura.

Palavras chave: $ZrO_2(Y_2O_3)$ nanocristalina, nanoestrutura, sinterização, crescimento de grão, análise digital de imagens.

Abstract

In this work, the effect of sintering parameters on the grain growth of sintered Y-TZP nanometric ceramics at 1300° C and 1400° C was studied using digital processing. Zirconia powders were compacted at 80MPa and then sintered at 1300°C or 1400°C at different levels, ranging from 2 to 16h, and then characterized by X-ray diffraction and relative density in scanning electron microscopy. The results indicated that in all sintering conditions the relative density obtained was higher than 97% regardless of the sintering condition used. In all samples tetragonal ZrO2 was the main crystalline phase observed. The microstructural characterization indicates that the powders present average nanometric sizes varying between 40-90 nm and 55-160 nm, as a function of the plateau time at 1300° C and 1400° C respectively. The results are discussed as a function of the observed grain growth and the effects of these nanostructured characteristics on their respective fracture toughness.

Keywords: $ZrO_2(Y_2O_3)$ *nanocrystalline, nanostructure, sintering, grain growth, digital image analysis*

INTRODUÇÃO

A zircônia tetragonal policristalina estabilizada com ítria (ZrO₂-Y₂O₃), também chamada de Y-TZP [1, 2], exibe uma excelente combinação de propriedades como alta rigidez, alta resistência à abrasão e inércia química, sendo amplamente utilizada e estudada cientificamente. Além disso, o Y-TZP está entre os materiais cerâmicos com maior tenacidade à fratura [3, 4]. Um dos maiores desafios para ampliar ainda mais o campo de aplicação de zircônia é a melhoria de sua confiabilidade pelo uso de materiais de partida de maior qualidade, bem como melhor controle e compreensão dos processos de processamento e sinterização. Nesse contexto, o domínio dos aspectos relacionados à densificação e ao desenvolvimento microestrutural durante a sinterização é fundamental para o sucesso. No passado, descobriu-se que a falta de controle de características microestruturais pode criar sérios problemas relacionados à falha de cerâmica, seja por crescimento exagerado de grãos ou falhas relacionadas à degradação dessas cerâmicas [1-3].

A utilização de pós de partida nanoparticulados na produção de materiais cerâmicos é de grande interesse científico e tecnológico, devido à sua maior sinterabilidade, que pode reduzir a temperatura e/ou o tempo de sinterização, resultando também em microestruturas de grão extremamente fino e com propriedades mecânicas aprimoradas. No caso de cerâmicas à base de ZrO₂, usando nanopartículas, foi relatada uma melhora na tenacidade à fratura devido à maximização da fase tetragonal e tensões geradas [5-7]. Portanto, o ciclo de sinterização deve ser cuidadosamente escolhido para aproveitar as propriedades únicas dos materiais nanoestruturados.

Diferentes estudos mostram a relação entre o processamento e o tamanho de grão adquirido. Kim et al. [8] utilizaram ZrO₂ ultrafina prensado a quente ($3mol\% Y_2O_3$) com um tamanho de partícula variando de 58 a 76nm sob uma pressão de 100MPa a 1000°C, obtendo materiais com um tamanho médio de grão de 0,25µm. Nos experimentos de Tekeli et al. [9], o ZrO₂ sinterizado estabilizou com 8mol% Y₂O₃ a 1350°C por 1h e atingiu densificação completa. Zhou et al. avaliaram o ZrO₂ sinterizado a 1350°C por 2h e posterior tratamento térmico das amostras por 2, 6, 12, 18, 24 ou 30h e observou tamanhos de grãos variando de 0,5 a 1,3µm.

O crescimento de grãos em materiais cerâmicos pode ser descrito pela Equação (A):

$$G(t)^n - G_0^n = kt \qquad (A)$$

Onde G (t) representa o tamanho de grão no tempo t, G_0 o tamanho de grão no tempo zero, n o expoente de crescimento de grão, k a constante de taxa de crescimento de grão que

depende da mobilidade de limite de grão e energia de superfície específica e t o tempo. A constante de velocidade de crescimento de grãos, k, pode ser determinada pela equação do tipo de Arrhenius (B):

$$k = k_0 . \exp\left(-\frac{Q}{R \cdot T}\right) \tag{B}$$

onde k representa a constante de velocidade, k_0 a constante pré-exponencial, Q a energia de ativação do crescimento de grão, R a constante de gás universal e T a temperatura absoluta. Rearranjando a equação (A) e (B) é possível calcular a constante de crescimento de grãos k, pela seguinte equação:

$$k = \frac{G^n - G_0^n}{t} \tag{C}$$

Nesse trabalho cerâmicas a base de $ZrO_2(Y_2O_3)$ nanométrica foram sinterizadas a 1300°C ou 1400°C, afim de analisar os efeitos da temperatura e do tempo de sinterização no seu crescimento de grão.

MATERIAIS E MÉTODOS

O material utilizado neste trabalho foi um pó nanocristalino de zircônia (ZrO_2) estabilizada com 3% mol de ítria (Y_2O_3), contendo ligante depositado por "*spray-drier*", que foi adquirido da empresa TOSOH Corp. (Japão). A tabela I apresenta as características químicas e físicas fornecidas pelo fabricante.

Propriedades	Valores	
%Y ₂ O ₃	3% mol.	
Fases cristalinas (Relação T/M)	90% tetragonal / 10% monoclínica	
Tamanho do cristalito	30 nm	
Área superficial específica	23 m²/g	
Densidade Teórica	$6,05 \text{ g/cm}^3$	
Outras características	Pó com morfologia esférica apresentando 3 % peso de ligante.	

Tabela I – Especificações da matéria prima utilizada neste trabalho

Corpos à verde foram confeccionados utilizando uma matriz cilíndrica de aço temperado, de 10 mm de diâmetro. O pó de zircônia foi compactado a 80 MPa, por 30s, e obtendo-se corpos à verde com 10 mm de diâmetro e 5 mm de altura.

Os corpos à verde foram então sinterizados nas temperaturas de 1300°C e 1400°C utilizando forno modelo FE1600 – INTI, com patamares de 0, 2, 4, 8 e 16 horas, com taxas de aquecimento e resfriamento de 5°C/min.

O cálculo da massa específica aparente foi realizado utilizando o princípio de Arquimedes. A densidade relativa foi calculada pela relação entre a massa específica aparente da cerâmica sinterizada e a massa específica teórica fornecida pelo fabricante.

As fases cristalinas presentes no pós de partida e nas amostras sinterizadas, foram identificadas por difração de raios X modelo XRD–6000 da Shimadzu, utilizando radiação Cu-K α com varredura entre 20^o e 80^o, aplicando-se passo de 0,05^o e 3 segundos por contagem.

Na etapa de lixamento, usou-se as granas de diamante de 40 e 20 μ m. Em seguida foi realizado polimento das amostras, utilizando suspensões de diamante com granulometrias de 15, 9, 6 μ m. Nas etapas de lixamento e polimento semi-automático, usou-se uma politriz JEAN WIRTZ – Phoenix 4000 da Buehler. Para o polimento automático, etapa final da preparação, utilizou-se suspensões de diamante com granulometrias de 3 e 1 μ m, utilizando e a rotação constante de 300 rpm - 20 minutos, com uma carga de 100 N, utilizando politriz automática Espectrum System 1000 da LECO.

Após a etapa de preparação ceramográfica, foi realizado ataque térmico, tendo como objetivo a revelação da microestrutura do material. Para as amostras sinterizadas a 1300°C foi feito o ataque térmico a 1280°C com patamar de 15 minutos, a taxa de aquecimento foi de 20°C/min e de resfriamento de 10°C/min. Para as amostras sinterizadas a 1400°C foi feito o ataque térmico a 1380°C com patamar de 15 minutos, a taxa de aquecimento foi de 20 °C/min e de resfriamento de 10 °C/min.

Para a aquisição e captura das micrografias foi utilizado um microscópio Leica modelo DM IRM. Este equipamento possui uma câmera analógica Samsung modelo SCC 131 acoplada a um analisador de imagens Leica QWin. O analisador utiliza um software QWin versão 2.3 Standard. Todas as imagens capturadas pelo analisador apresentaram uma resolução de 640 x 480 pixels.

A perfilômetria pelo método *stylus* é uma caracterização topográfica feita com uma agulha (geralmente de diamante) que se move verticalmente à medida que realiza a varredura da amostra. O movimento da agulha é registrado com um transdutor, gerando resultado da rugosidade superficial da amostra. Este método é ideal para varredura de superfícies duras em que se exige baixa resolução lateral (quando comparado com um Microscópio de Força Atômica) [10].

Na perfilômetria óptica, uma fonte de luz colimada, acoplada a um microscópio, ilumina simultaneamente a superfície em estudo e uma superfície de referência. Quando os raios de luz são refletidos pelas duas superfícies, são combinados e formam-se franjas de interferência, cuja *Transformada de Fourier* fornece uma representação topográfica da superfície. O diferencial dessa metodologia em relação à perfilometria *stylus* é a maior precisão e a leitura de uma área mais representativa, e não apenas de uma linha, como ocorre no perfilômetro *stylus* [10]. Foi utilizado nesta etapa o perfilômetro óptico da marca VEECO modelo WYKO NT 1100.

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), foi realizada utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura da JEOL, modelo JSM – 5310.

Por meio da microscopia de força atômica foi possível gerar um mapa topográfico da amostra. O Microscópio de Força Atômica (AFM) da VEECO, modelo Multimode V, foi utilizado com uma ponta de silício no modo de contato intermitente "tapping mode", para obtenção das imagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta os resultados de densidade relativa em função da temperatura de sinterização. É observado que o material apresentou melhor densificação em temperaturas mais altas, chegando à ordem de 100%, para as amostras sinterizadas a 1400°C por 8 a 16 horas, resultado superior aos obtidos para amostras sinterizadas a 1300°C, as quais atingiram no máximo 99,8% para a amostra sinterizada a 1300°C por 16 horas.



Figura 1 – Influência da temperatura de sinterização na densificação.

Os difratogramas de raios X das amostras sinterizadas em diferentes temperaturas e tempos, são apresentados nas Figuras 2 (a) e (b).

Foi avaliada a identificação qualitativa das fases cristalinas após a comparação dos dados obtidos relativos à posição e intensidade dos picos de difração com o conjunto de dados de padrões fornecidos pelo Centro Internacional para Dados de Difração (ICDD – International Center for Diffraction Data) com o uso de cartões JCPDS (Joint Committe on Powder Diffraction Standards). Após a sinterização, independentemente da temperatura

utilizada, o percentual de fase monoclínica presente na matéria prima, se transformou totalmente em tetragonal, pois há temperatura, tempo, taxas de resfriamento e teores de Y_2O_3 suficientes para estabilização total da zircônia tetragonal em temperatura ambiente. A fase zircônia tetragonal confere ao material melhor tenacidade à fratura, aumentando a sua confiabilidade para aplicações estruturais.



Figura 2 – Difratogramas de raios X: (a) amostras sinterizadas a 1300°C em diferentes tempos; (b) amostras sinterizadas a 1400°C em diferentes tempos.

A Figura 3 apresenta as imagens topográficas em 3 dimensões, da superfície das amostras sinterizadas a 1300°C e 1400°C por diferentes tempos. A análise topográfica é muito importante para a correlação da preparação ceramográfica com os defeitos superficiais nas amostras. Nas imagens topográficas obtidas via perfilômetria óptica, os picos são representados por cor vermelha e os vales pela cor azul. É possível notar que a amostra 1300°C/0h apresenta uma maior concentração de regiões com picos e vales, e alguns poros proeminientes.



Figura 3 - Imagens topográficas da superfície da amostra de ZrO₂ (3 % mol Y₂O₃) obtidas por perfilometria óptica sinterizada: (a) 1300°C/0h; (b) 1300°C/16h; (c) 1400°C/0h; (d) 1400°C/16h;

A Figura 4 apresenta as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura das superfícies das amostras sinterizadas em condições extremas (1300°C por 0 horas (ausência de isoterma) e 1400°C por 16 horas).



Figura 4 – Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura das superfícies das amostras de ZrO2 (3 % mol Y_2O_3) sinterizadas a: (a) 1300°C/0h, (b) 1400°C/16h.

Pela observação das micrografias, Figura 4, obtidas por MEV no modo elétrons secundários, nota-se que a amostra sinterizada a 1300°C/0h (ausência de isoterma) representada pela imagem (a) apresenta microporos em sua superfície, como resultado de uma menor densidade relativa, 97,1 \pm 0,7 (%), quando comparada com a amostra sinterizada a 1400°C por 16 horas, que apresenta praticamente 100% de densidade relativa. Nessa figura nota-se que a amostra sinterizada a 1400°C por 16 horas, que apresenta praticamente 100% de densidade relativa. Nessa figura nota-se que a amostra sinterizada a 1400°C por 16 horas, não apresenta microporosidade superficial. Pode-se observar a presença de grãos equiaxiais de zircônia, mostrando que os aumentos da temperatura e do tempo de sinterização favorecem significativamente o crescimento dos grãos [12].



Figura 5 – Micrografia obtida por microscopia de força atômica da superfície da amostra de ZrO₂ (3 % mol Y₂O₃) sinterizada a: (a) 1300°C/0h; (b) 1300°C/2h; (c) 1300°C/4h; (d) 1300°C/8h; (e) 1300°C/16h; (f) 1400°C/0h; (g) 1400°C/2h; (h) 1400°C/4h; (i) 1400°C/8h; (j) 1400°C/16h.

A microscopia de força atômica foi utilizada para caracterizar o delineamento dos contornos de grão, como uma alternativa ao insucesso da caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura. O processamento digital das imagens foi feito com auxílio do software livre *Image J*, tendo como objetivo a melhoria do delineamento dos contornos de grão e determinação dos parâmetros microestruturais, tais como o tamanho médio de grãos (μ m) e a densidade de grãos por unidade de área (n° grãos/ μ m²).

A Figura 5 apresenta a micrografia obtida por microscopia de força atômica para as amostras sinterizadas a 1300°C ou a 1400°C por 0, 2, 4, 8 e 16h. Os valores dos tamanhos médios de grãos (D_m) das amostras sinterizadas a 1300°C e 1400°C por 2, 4, 8 e 16 horas, estão apresentados na Tabela II. Além disso, a Figura 6 apresenta as curvas de variação dos tamanhos médios de grãos (μ m) e as curvas de variação das densidades de grãos (n° grãos/ μ m²) em função da temperatura e do tempo de sinterização.

Tabela II - Tamanhos médios de grãos (D_m) das amostras sinterizadas a 1300°C e 1400°C por 2, 4, 8 e 16 horas.

Condição de Sinterização	D _m (µm)	Condição de Sinterização	D _m (μm)
1300°C/2h	0,039±0,02	1400°C/2h	0,055±0,04
1300°C/4h	$0,048\pm0,06$	1400°C/4h	$0,089{\pm}0,08$
1300°C/8h	0,061±0,07	1400°C/8h	0,132±0,10
1300°C/16h	$0,088 \pm 0,07$	1400°C/16h	0,160±0,14

A amostra sinterizada a 1400°C por 16 horas, representada pelas figuras 5, apresenta uma microestrutura com grãos micrométricos, podendo-se observar a presença de heterogeneidade no diâmetro médio dos grãos, mostrando que os tratamentos térmicos por longos tempos favorecem o crescimento preferencial de alguns grãos [12]. Com os valores da Tabela II, pode-se observar que quanto maior for à temperatura e tempo de sinterização, maior será o desvio padrão do diâmetro médio dos grãos, confirmando a existência de um crescimento heterogêneo de grãos. A metodologia utilizada para a revelação microestrutural das amostras cerâmicas a base de $ZrO_2(Y_2O_3)$ nanométrica, de forma padronizada e com representatividade estatística, mostrou-se eficiente, levando a resultados que podem ser utilizados para verificar as correlações entre as propriedades mecânicas e a microestrutura dos materiais. Foi possível estudar os efeitos da temperatura e do tempo de sinterização na cinética de crescimento de grãos.



Figura 6 – Efeito de tempo de isoterma no tamanho médio de grãos (μ m) e densidades de grãos (n° grãos/ μ m²) das amostras de ZrO₂ (3 %mol Y₂O₃) sinterizadas a 1300°C e 1400°C.



Figura 7 - Linearização do tamanho médio de grão em função do tempo de patamar.

A Figura 7 apresenta os resultados da linearização dos tamanhos de grão das cerâmicas, em função das temperaturas de sinterização estudadas. É possível observar que em ambas temperaturas, o expoente de crescimento de grão, n, calculado a partir das equações (A), (B) e (C) é de 2,0 e 2,6 para as temperaturas estudadas. Esses valores correspondem a crescimento de grão regido por difusão de contornos de grão.

CONCLUSÕES

Neste trabalho, foram sinterizadas cerâmicas a base de $ZrO_2(Y_2O_3)$ e analisados os efeitos da temperatura e do tempo de sinterização no crescimento de grão. Foi possível verificar que foi obtida densificação completa para amostras sinterizadas a 1400°C (8h a 16h em isoterma). Os tratamentos térmicos por longos períodos induzem o crescimento

preferencial de alguns grãos, levando a uma distribuição bimodal consoante ao aumento da temperatura e tempo de sinterização. Além disso, o valor do expoente de crescimento de grão encontrado corresponde a um crescimento de grão regido por difusão de contornos de grão.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a FAPERJ (processo E26-202.997/2017) e ao CNPq (processo) pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

[1] Hench, LL. Bioceramics. Journal of the American Ceramic Society, 81 [7], 1705-1728, 1998.

[2] Anusavice, KJ. Phillips Materiais Dentários. 11nd Ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, p.800, 2005

[3] Willians, DF. Medical and Dental Materials. Weinheim: Volume Editor D. F. Williams, VCH, 1991. p.469 (Materials Science and Technology, Vol. 14).

[4] Stevens, R. An introduction to zirconia: zirconia and zirconia ceramics. 2nd ed. New York: Twickenham Magnesium Electrum; 1986.

[5] Kelly, JR; Denry, I. Stabilized zirconia as a structural ceramic: an overview.Dental Materials, Washington, 24. 289-298, 2008.

[6] Fang, ZZ; Wang, H. Densification and grain growth during sintering of nanoparticled particles. International Materials Reviews, 53 [6] 326-352, 2008.

[7] Koch, CC. Structural nanocrystalline materials: an overview. Journal of Materials Science, 42 [5]. 1403-1414, 2007.

[8] Kim, H-C.; Sho, I-J.; Jeong, I-K; Ko, I-Y, Munir RZA. Sintering of ultra-fine tetragonal yttria-stabilized zircônia ceramics. Journal of Material Science, 42, 9409-9414, 2007.

[9] Tekeli, S.; Erdogan, M.; Aktas B. Influence of α -Al2O3 addition on sintering and grain growth behaviour of 8 mol% Y2O3-stabilised cubic zirconi (c-ZrO2). Ceramic Internacional, 30[8], 2203-2209, 2004.

[10] SILVA, A. A. Efeitos topográficos em espectros RBS. 130 p. Tese (Doutorado em Ciências), São Paulo – SP, Instituto de Física da Universidade de São Paulo, 2006.

[11] GOLDSTEIN, J.I. Scanning microscopy and X-ray microanalysis 2nd.ed.. New York: Plenium Press, 1992.

[12] KWON, N., KIM, G., SONG, H. S., LEE, H. Synthesis and properties of cubic zircônia alumina composite by mechanical alloying. Mater. Sci. Eng., v. A299, p. 185-194, 2001.